

先端プローブ顕微鏡(SPM)によるグリーンデバイス・材料解析

主催: 日本顕微鏡学会 走査プローブ顕微鏡分科会

日時: 9月3日(木) 10:00~17:20 (受付:9:30~)

場所: 幕張メッセ国際会議場1階 106 会議室

参加費: 参加費(予稿集[テキスト]代を含む) 3000円

事前登録: h.itoh@aist.go.jp, j-niitsuma@aist.go.jp の両方宛(又は Fax 029-861-5301)に氏名・所属・電話・FAX を記載して、件名に”JASIS SPM 申込“と書いて8月20日(水)までに E-Mail(又は FAX)で申込み下さい。

問合先: 氏名(所属) 井藤浩志(産業技術総合研究所) Tel:029-861-5752 E-mail:h.itoh@aist.go.jp

URL: 日本顕微鏡学会 <http://www.microscopy.or.jp/meeting/index.html>

グリーン材料・デバイス分析に必要な、走査型プローブ顕微鏡(SPM)の先端研究と、SPMを利用するための基本技術の解説を行うことを目的としたセミナーです。ナノスケールでの電気測定、溶液中での電気化学測定、ソフトマテリアル・高分子材料の熱・機械物性の話題、周波数制御型SPMの実用計測での利点を取り上げます。SPMメーカーからの最新の製品紹介も行われ、講師やメーカーの方と技術相談・機器導入相談も歓迎します。

時間	タイトル	講演者(所属)
10:00-10:10	開会あいさつ	井藤 浩志 (産業技術総合研究所)
10:10-10:50	高空間分解能拡がり抵抗顕微鏡SSRMによるSiデバイス拡散層2次元キャリア分布評価	張 利 (東芝)
10:50-11:40	有機薄膜トランジスタの局所電子物性評価 (*KPFMの技術解説を含みます。)	小林 圭 (京都大学)
11:40-12:10	走査プローブ顕微鏡、および、関連製品の紹介(各5分) ブルカーナノ表面計測、日立ハイテクサイエンス、島津製作所、生体分子計測研究所、オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社、東陽テクニカ	
12:10-14:10	休憩 (JASIS展をご覧ください)	
14:10-14:15	事務連絡	
14:15-15:05	qPlus AFMによる固-液界面分析と電気化学への応用	一井 崇 (京都大学)
15:05-15:55	FM-AFMの高分子材料への応用とAM-AFMとの比較	粉川 良平 (島津製作所)
15:55-16:35	SPMによる有機高分子材料の解析 ~モルフォロジー観察や熱物性評価を中心に~	岩佐 真行 (日立ハイテクサイエンス)
16:35-17:15	原子間力顕微鏡による材料の粘弾性解析技術	中嶋 健 (東京工業大学)
17:15-17:20	閉会あいさつ	藤田 大介 (物質材料研究機構)